



# 中华人民共和国国家计量技术规范

JJF 1254—2010

---

## 数显测高仪校准规范

Calibration Specification for Height Measuring Instrument  
with Digital Display

2010—05—11 发布

2010—11—11 实施

---

国家质量监督检验检疫总局 发布

# 数显测高仪校准规范

Calibration Specification for  
Height Measuring Instrument  
with Digital Display

JJF 1254—2010  
代替 JJG 929—1998

---

本规范经国家质量监督检验检疫总局于 2010 年 5 月 11 日批准，并自 2010 年 11 月 11 日起施行。

归口单位：全国几何量工程参量计量技术委员会

主要起草单位：中国科学院光电技术研究所

参加起草单位：中国测试技术研究院

本规范由全国几何量工程参量计量技术委员会负责解释

**本规范主要起草人：**

匡 龙（中国科学院光电技术研究所）

耿丽红（中国科学院光电技术研究所）

曹学东（中国科学院光电技术研究所）

**参加起草人：**

冉 庆（中国测试技术研究院）

## 目 录

1 范围	( 1 )
2 引用文献	( 1 )
3 概述	( 1 )
4 计量特性	( 2 )
4.1 测量力	( 2 )
4.2 垂直度	( 2 )
4.3 示值变动性	( 2 )
4.4 示值误差	( 2 )
5 校准条件	( 2 )
5.1 环境条件	( 2 )
5.2 测量标准器及其他设备	( 3 )
6 校准项目和校准方法	( 3 )
6.1 测量力	( 3 )
6.2 垂直度	( 3 )
6.3 示值变动性	( 4 )
6.4 示值误差	( 4 )
7 校准结果表达	( 4 )
8 复校时间间隔	( 4 )
附录 A 数显测高仪示值误差测量结果不确定度评定	( 5 )
附录 B 校准证书内容	( 8 )

# 数显测高仪校准规范

## 1 范围

本规范适用于分辨力为  $0.1\ \mu\text{m}$ 、 $0.2\ \mu\text{m}$ 、 $0.5\ \mu\text{m}$  和  $1\ \mu\text{m}$ ，量程  $0\ \text{mm}$  至  $1\ 000\ \text{mm}$  的数显测高仪的校准。

## 2 引用文献

本规范引用下列文献：

JJF 1001—1998 通用计量术语及定义

JJF 1094—2002 测量仪器特性评定

JJF 1130—2005 几何量测量设备校准中的不确定度评定指南

GB/T 22094—2008 电子数显测高仪

使用本规范时，应注意使用上述引用文献的现行有效版本。

## 3 概述

数显测高仪是基于精密机械、现代传感技术和电子技术的立式单坐标数字化几何量测量仪器，用来测量平行平面之间距离、孔和轴直径、中心距以及相关形位误差等。其外形结构见图 1。

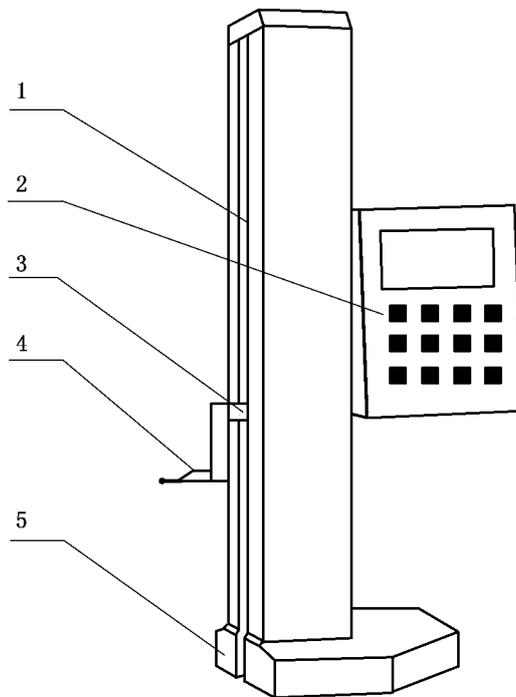


图 1 数显测高仪外形结构示意图

1—立柱；2—控制与显示器；3—测量滑座；4—测头；5—底座